Получение и оптические свойства тонких пленок политипов $ZnIn_2S_4$ (I, III)

Е. Д. Арама^а, Д. И. Озол^b, В. А. Пынтя^с, Т. Д. Шемякова^{d*}, Н. А. Гашицой^е

^аМедицинский и фармацевтический университет им. Н. Тестемицану, г. Кишинев, MD-2004, Молдова

^bМосковский физико-технический университет, г. Долгопрудный, 141700, Московская область, Россия

^cТехнический университет Молдовы, г. Кишинев, MD-2004, Молдова

^dИнститут прикладной физики, Молдавский государственный университет, г. Кишинев, MD-2028, Молдова

^e Бельцкий государственный университет им. Алеку Руссо, г. Бельцы, MD-3100, Молдова

^e е-mail: shemyakova@yahoo.com

Поступила в редакцию 03.04.2024 После доработки 03.05.2024 Принята к публикации 10.05.2024

Подобраны технологические условия и методом осаждения в квазизамкнутом объеме получены тонкие слои соединения $ZnIn_2S_4$ на неориентирующих и ориентирующих подложках из различных материалов: стекло, плавленый кварц, ситалл, прозрачные проводящие слои SnO_2 на стекле, пластины из меди и стали, слюда. На стеклянных подложках получены тонкие слои одно- и трехпакетных политипных модификаций соединения $ZnIn_2S_4$ (I, III) с плоскостью кристаллитов (0001) параллельной подложке. Изучена микроструктура пленок, полученных при разных режимах осаждения. Исследованы спектры оптического поглощения и возбуждения фотолюминесценции. Показано, что параметры слоев и монокристаллов близки.

Ключевые слова: ZnIn₂S₄, тройные полупроводники, тонкие пленки, метод вакуумного осаждения в квазизамкнутом объеме, коэффициент поглощения, фотолюминесценция

УДК 621.315.592 https://doi.org/10.52577/eom.2024.60.4.60 ВВЕДЕНИЕ

Полупроводниковые сульфидные соединения класса $A^2B_2^3C_4^6$ (где A – Zn, Cd и B – In, Ga) активно исследуются, поскольку обладают уникальными физическими свойствами - интенсивной фотолюминесценцией [1, 2] и высокой фоточувствительностью в широком ральном диапазоне [2, 3]; они высокоомны и устойчивы в обычных атмосферных условиях. В частности, описаны оптическое поглощение, отражение, фотоэлектрические и излучательные свойства монокристаллов ZnIn₂S₄ [2-4], которым в том числе присущи различные политипные модификации [5, 6]. Показано, что $ZnIn_2S_4$ в виде низкоомных тонких слоев является перспективным материалом для использования в солнечных элементах типа $n-Znln_2S_4/p-CulnSe_2$ [7].

Разработка экологически чистых и возобновляемых методов получения энергии, включая производство водорода, является актуальной задачей, поскольку запасы ископаемого топлива уменьшаются, а проблемы экологии становятся все более острыми. Фотокаталитическое производство водорода с использованием полупроводниковых материалов является одним из процессов прямого преобразования солнечной

энергии. Исследования фотокаталитического производства энергии с помощью сульфидных соединений важны с точки зрения практического применения. В последнее время возрос интерес исследователей к $ZnIn_2S_4$ поскольку по своим параметрам (ширина запрещенной зоны в видимом диапазоне и химическая стабильность) это соединение является перспективным для фотокаталитического разложения воды и получения водорода [8–11]. Опубликовано несколько сообщений о способности гексагонального $ZnIn_2S_4$ разлагать ряд красителей, что может быть использовано для защиты окружающей среды [12].

Чен с сотрудниками [13] синтезировал $ZnIn_2S_4$ в виде микросфер с различной кристаллической структурой, используя простой гидротермальный метод с заменой металла-предшественника. Пленки $ZnIn_2S_4$, состоящие из наноразмерных слоев, расположенных перпендикулярно подложке, получены на подложках фторированного оксида олова (FTO) гидротермальным методом и исследованы в качестве материала электродов для солнечных элементов [14]. Описан метод получения $ZnIn_2S_4$ в виде нано- и микроструктур из растворов. Гоу и соавторы [15]

синтезировали $ZnIn_2S_4$ с различной морфологией, включая нанотрубки, наноленты, нанопровод и микросферы гидротермальным и сольвотермальным методами. Эти работы подтверждают, что разработка технологии получения $ZnIn_2S_4$ в виде пленок и структур с различной морфологией представляет интерес и важна для их возможного практического применения.

Метод получения тонких слоев соединений А₂В₆ и их твердых растворов в квазизамкнутом объеме в его различных вариантах - осаждение в замкнутом объеме (close-spaced sublimation), вакуумное осаждение в замкнутом объеме (closespaced vacuum sublimation) или метод горячей стенки (hot wall epitaxy), исследуется давно и всесторонне. По данному вопросу опубликовано множество работ. Но по применению указанного метода для получения слоев тройных полупроводниковых соединений, в том числе ZnIn₂S₄, имеется только очень ограниченное число публикаций, например [4, 16]. Есть также работы, в которых сообщается о том, что этим методом впервые получены тонкие слои тройных соединений MgGa₂S₄ [17] и BaIn₂S₄ [18].

Известно, что получение полупроводниковых материалов в виде тонких пленок расширяет возможности вариации свойств, увеличивает действующую площадь устройства. При этом обычно стремятся получить пленки с воспроизводимыми параметрами, близкими к параметрам объемных кристаллов. Разработка простых и недорогих методов получения тонких полупроводниковых пленок остается актуальной проблемой. Наша задача состояла в том, чтобы детально исследовать технологию получения и оптические свойства тонких пленок ZnIn₂S₄ в виде одно- и трехпакетных политипов.

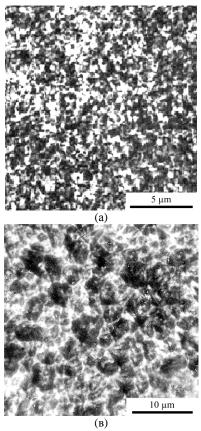
МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА

Получение тонких пленок проводили на неориентирующих и ориентирующих подложках из таких различных материалов, как стекло, плавленый кварц, ситалл, прозрачные проводящие слои SnO₂ на стекле, пластины из меди и стали, слюда. Слои диаметром 15 мм получали методом осаждения в квазизамкнутом объеме. Устройство для получения слоев представляет собой разборный кварцевый тигель объемом ~ 2 см³ с тепловой изоляцией и раздельным подогревом в зоне испарителя и зоне подложки, который размещается внутри откачиваемого объема вакуумной установки ВУП-2К. Монокристаллы соединения были выращены при разработанных ранее условиях методом химических транспортных реакций с использованием йода в качестве переносчика. Отличие в том, что для повышения темнового сопротивления и фоточувствительности процесс транспорта проводили при избыточном содержании серы из расчета $ZnIn_2S_{4,05}$. Эти кристаллы применяли в качестве исходного материала для загрузки испарителя. Метод получения пленок $ZnIn_2S_4$ и бинарных халькогенидов описан ранее [16, 19]. Были подобраны оптимальные температуры испарителя и подложки с расчетом получения хорошо ориентированных пленок. Для контроля состава пленок сравнивали рентгеновские дебаеграммы пленок и исходных кристаллов. Микроструктуру пленок изучали с помощью микроскопов Amplival и XJL-101.

Оптические спектры исследовали стандартных установках, разработанных ранее [20, 21]. Спектры поглощения и возбуждения люминесценции измеряли на образцах средней толщины. Установка содержала монохроматор ДМР-4, фотоумножитель ФЭУ-28, усилитель оптического сигнала, модулятор, измерения проводили при комнатной температуре. Регистрация спектров велась автоматически.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Для определения оптимальных условий получения тонких слоев ZnIn₂S₄ с параметрами, близкими к параметрам испаряемых монокристаллов, был изготовлен ряд образцов при различных температурах испарителя и подложки и разности температур между ними. Температуру испарителя варьировали в интервале 700-1100 °C, температуру подложки – в пределах 300–700 °C. Экспериментально определили минимальную температуру испарителя $T_{\text{мин}}$. При верхнем пределе температуры испарителя наблюдается заметная диссоциация вещества. Наиболее существенные изменения структуры тонких слоев ZnIn₂S₄ имеют место при разности температур $T_{\text{исп}}$ - $T_{\text{подл}}$ В интервале 340-380 При средних значениях $T_{\text{подл}}$ микроструктура пленок изменяется заметно, когда температура испарителя лежит в интервале $T_{\rm исп} = (1,3-1,5)$ $T_{\text{подл}}$ средней, варьировали $T_{\text{мин}}$. Сохраняя градиент температуры между подложкой и испарителем в пределах 300-500 °C. На всех указанных выше видах подложек получены однородные сплошные поликристаллические и крупноблочные слои с хорошей адгезией к подложке. Установлено, что морфология поверхности слоев (размер кристаллитов и шероховатость) сильно зависит от градиента температуры (разности температур испарителя и подложки), скорости осаждения и толщины получаемого слоя.



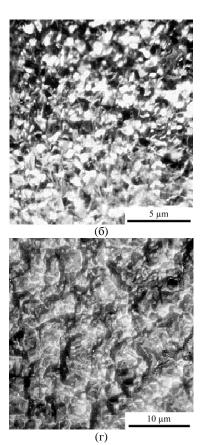


Рис. 1. Микроструктура тонких пленок $ZnIn_2S_4$, полученных на подложках стекло/ SnO_2 при постоянной температуре испарителя и различных значениях температуры подложки: 300 (a), 350 (б), 400 (в), 450 ° С (г).

Микрофотографии слоев $ZnIn_2S_4$ на чистых стеклянных подложках были приведены ранее [4]. На рис. 1 представлены микрофотографии поверхности слоев $ZnIn_2S_4$ на подложках стекло/ SnO_2 , полученных при $T_{\rm исп}=1,3T_{\rm мин}$, по которым можно проследить изменение морфологии поверхности слоя в зависимости от $T_{\rm подл}$. Видно, что изменение $T_{\rm подл}$ вызывает изменение структуры слоев от поликристаллической с различным размером зерен до крупноблочной.

Рост градиента температуры $T_{\rm исп} - T_{\rm подл}$ в области 300-500 °C приводит к постепенному увеличению размеров кристаллитов. В интервале температуры подложки 300-400 °C получены поликристаллические слои c различным размером зерен, который увеличивается при увеличении температуры (рис. 1а,б). При дальнейшем повышении температуры подложки и толщины осаждаемого слоя наблюдается упорядочение фигур роста пленки (рис. 1в,г), мелкие кристаллиты сливаются в крупные блоки. градиенте температуры 350-400 При плоскость (0001) кристаллитов параллельна плоскости подложки. Эти изменения структуры приводят и к вариации физических свойств.

Закономерности получения слоев $ZnIn_2S_4$ на указанных выше видах неориентирующих подложек в основном очень схожи. Изменения средних размеров кристаллитов при изменении режима осаждения можно видеть на рис. 2,

где представлена зависимость размеров кристаллитов от $T_{\rm исп}$ и от разности температур между испарителем и подложкой. Лучшие условия роста пленок наблюдались при $T_{\rm подл}=350$ —400 °C и отношении $T/T_{\rm мин}=1,4$.

При оптимальных режимах, определенных при осаждении на неориентирующие подложки, получены слои тиоиндата серы на ориентирующих подложках (сколах слюды). Нами была изучена зависимость морфологии поверхности и размера характерных фигур роста от основных параметров процесса осаждения (температуры испарителя, подложки, разности температур испарителя и подложки, скорости роста). Установлено, что морфология поверхности и размеры фигур роста сильно зависят как от режима получения, так и от толщины слоя. Микрофотографии поверхности слоев ZnIn₂S₄ на слюде представлены на рис. 3. При температурах подложки менее 300-350 °C наблюдается рост поликристаллических слоев. При температурах подложки более 400 °C и небольшой разности температур между подложкой и испарителем растут крупноблочные слои с характерными шестиугольными фигурами роста, которых увеличивается, когда условия роста приближаются к термодинамически равновесным. На поверхности слоев толщиной менее 1 мкм образуются небольшие фигуры роста (рис. 3а). При температурах подложки около

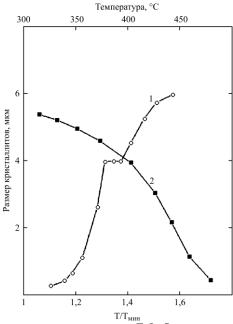
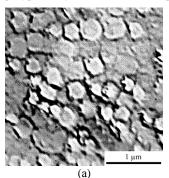
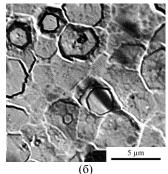


Рис. 2. Зависимость средних размеров кристаллитов в пленках $ZnIn_2S_4$ от температуры источника $T_{\rm исп}$ (I) и от разности температур между подложкой и испарителем ($T_{\rm исn}$ – $T_{\rm подл)}$ (2).





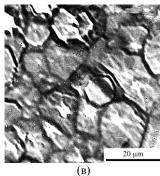


Рис. 3. Микрофотографии слоев $ZnIn_2S_4$ различной толщины (*d*) на подложках из слюды. d=1 мкм, $T_{noдл}=400$ °C (a), d=5 мкм, $T_{noдл}=450$ °C (б), d=20 мкм, $T_{noдл}=400$ °C (в).

450 °C и выше на поверхности слоев наблюдались плоские шестиугольные фигуры роста в виде призм небольшой высоты, а также в виде углублений, что говорит о наличии реиспарения вещества с поверхности пленки (рис. 36). Поверхность слоев толщиной более 20 мкм, как правило, состоит из крупных кристаллических блоков неправильной формы, среди которых встречаются и шестиугольные фигуры роста (рис. 3в).

На рис. 4 и 5 представлена зависимость среднего размера фигур роста слоев (d) от температуры подложки, испарителя и скорости осаждения. Отсюда следует, что при фиксированной температуре испарителя с повышением температуры подложки наблюдается монотонное увеличение размеров фигур роста (рис. 4). Зависимость размера фигур роста от скорости осаждения имеет вид кривой с макси-MVMOM, соответствующим скорости 1 мкм/мин (рис. 5а). С ростом температуры испарителя при фиксированной температуре подложки также происходит vвеличение размеров фигур роста (рис. 5б).

Определены условия получения тонких слоев одно- и трехпакетного политипов $ZnIn_2S_4(I,\ III)$ на подложках из чистого стекла. Политип $ZnIn_2S_4$ (III) является более высокотемпературной фазой. Для его выращивания температура испарителя должна быть примерно на $100-150~^{\circ}C$ выше, чем для выращивания $ZnIn_2S_4$ политипа (I); разность температур между источником и подложкой также должна быть выше. Для слоев одно- и трехпакетного политипов $ZnIn_2S_4(I,\ III)$ на подложках из чистого стекла измерены спектральная зависимость коэффициента поглощения и спектры возбуждения фотолюминесценции.

Ранее по измерениям коэффициента поглощения в широком диапазоне спектра $(10-10^4~{\rm cm}^{-1})$ на монокристаллах ${\rm ZnIn_2S_4}$ (III) было установлено, что экспериментальные данные соответствуют экспоненциальной зависимости $\alpha(h\nu) = A\exp(h\nu/\Delta)$, где Δ – крутизна края поглощения [22]. Этой же зависимости соответствуют и экспериментальные данные, полученные для тонких пленок одно- и трехпа-

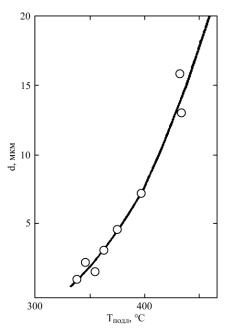


Рис. 4. Зависимость среднего размера фигур роста слоев $ZnIn_2S_4$ на слюде от температуры подложки.

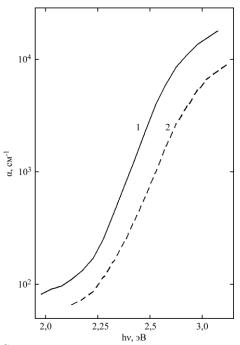


Рис. 6. Спектр краевого поглощения тонких пленок ${\rm ZnIn_2S_4}$ политип III (*I*), политип I (*2*). T = 300 K.

кетной модификации (рис. 6), на участке $\alpha = 10^4 \text{ cm}^{-1}$. B случае $\alpha < 10^4$ наблюдается более слабая зависимость типа $\alpha(h\nu) = \left[(h\nu) - E_g \right]^{1/2}.$ Эти зависимости обусловлены прямыми разрешенными переходами с $E_g = 2.5$ и 2.6 эВ для $ZnIn_2S_4$ (III и I), соответственно. Известно, что ширина запрещенной зоны ZnIn₂S₄, полученного различными методами в виде микро- и наноструктур, лежит в пределах от 2,2 до 2,8 эВ в зависимости от фазового состава, размера частиц и их морфологии [13]. Наши результаты согласуются с опубликованными данными.

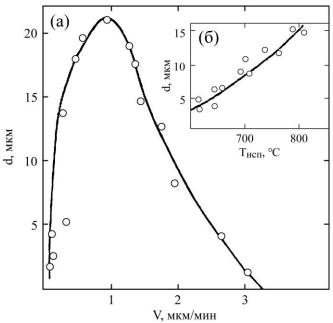


Рис. 5. Зависимость среднего размера фигур роста слоев $ZnIn_2S_4$ на слюде от скорости осаждения (а) и от температуры испарителя (б).

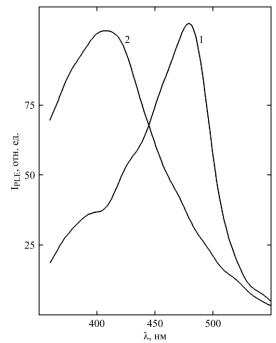


Рис. 7. Спектры возбуждения фотолюминесценции тонких пленок ${\rm ZnIn_2S_4}$ политип III (*I*), политип I (*2*). $T=300~{\rm K.}$

Спектры фотолюминесценции измеряли при комнатной температуре. Спектры излучения соединения обычно трехпакетного политипа представляют собой колоколообразную широкую полосу с максимумом при 745 нм. Аналогичная кривая люминесценции наблюдалась и в работе [21]. На рис. 7 представлены спектры возбуждения люминесценции, которые также близки К гауссовой Для $ZnIn_2S_4(III)$ (рис. 7, кривая 1) имеется слабая особенность при 400 нм и интенсивный максимум в области 485 нм. В случае ZnIn₂S₄ (I) (рис. 7, кривая 2) имеется один широкий максимумом при 400 нм. На наш взгляд, для обеих политипных модификаций спектры обусловлены собственным поглощением. Максимум при 485 нм связан с внутризонной рекомбинацией. Эти данные согласовываются и с оптическим поглощением.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экспериментально подобраны технологические условия и методом осаждения в квазизамкнутом объеме получены тонкие слои соединения ZnIn₂S₄ на неориентирующих и ориентирующих подложках из таких различных материалов, как стекло, плавленый кварц, ситалл, прозрачные проводящие слои SnO₂ на стекле, пластины из меди и стали, слюда. Показано, что данный метод позволяет в широких пределах варьировать толщину и структуру слоев, размер блоков, кристаллических шероховатость общую активную поверхность. На стеклянных подложках получены тонкие пленки одно- и трехпакетных политипных модификаций соединения $ZnIn_2S_4(I, III)$ с плоскостью кристаллитов (0001) параллельной подложке. Установлены оптимальные условия роста пленок. Изучены спектры оптического поглощения и возбуждения фотолюминесценции. Обнаружены области спектра, обусловленные прямыми разрешенными переходами и внутризонной рекомбинацией. Показано, что параметры слоев близки к параметрам монокристаллов.

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

Авторы заявляют, что у них нет конфликта интересов.

ЛИТЕРАТУРА

- Zhitar V.F., Pavlenko, V.I., Arama, E.D. and Shemyakova, T.D., Recombination properties of ZnIn₂S₄ single crystals, *Proc. Int. Semicond. Conf. CAS 2008*. Sinaia, 2008, vol. 2, p. 241.
- 2. Житарь, В.Ф., Павленко, В.И., Анизотропия фотопроводимости и люминесценции монокристаллов $ZnIn_2S_4$ и $ZnIn_2S_4$:Си, *Неорг. мат.*, 2010, т. 6, № 4, с. 346.
- 3. Георгобиани, А.Н., Радауцан, С.И., Тигиняну, И.М., Широкозонные полупроводники: оптические и фотоэлектрические свойства и перспективы применени, $\Phi T\Pi$, 1985, т. 19, № 2, с. 193.
- 4. Доника, Ф.Г., Житарь, В.Ф., Радауцан, С.И., Полупроводники системы $ZnS In_2S_3$. Кишинев: Штиинца, 1980. 148 с.
- Доника, Ф.Г., Радауцан, С.И., Семилетов, С.А. и др. Кристаллическая структура двухпакетного политипа ZnIn₂S₄ (II), Кристаллография, 1971, т. 17, № 3, с. 663.
- 6. Radautsan, S.I., Donika, F.G., Kyosse, G.A. and Mustya, G., Polytypism of ternary phases in the

- system Zn–In–S, *Phys. Stat. Sol.*, 1970, vol. 37, no. 2, p. K123.
- Vigil, O., Calzadilla, O., Seuret, D., Vidal, J., et al., Znln₂S₄ as a window in heterojunction solar cells, Sol. Energ. Mater., 1984, vol. 10, no. 2, p. 139.
- 8. Chong, W.K., Ng, B.J., Lee, Y.J., Tan, L.L., et al., Self-activated superhydrophilic green ZnIn₂S₄ realizing solar-driven overall water splitting: close-to-unity stability for a full daytime, *Nature Commun.*, 2023, vol. 14, art. ID 7676.
- 9. Yadav, G. and Ahmaruzzaman, Md., Recent progress on synthesis and modifications of ZnIn₂S₄ based novel hybrid materials for potential applications, *Mater. Sci. Eng.: B*, 2023, vol. 292, art. ID 116418.
- 10. You, K., Li, B., Li, X., Li, R., et al., Efficient photocatalytic hydrogen production over ZnIn₂S₄ by producing sulfur vacancies and coupling with nickelbased polyoxometalate, *Chem. Commun.*, 2023, vol. 59, p. 10972.
- 11. Zheng, X., Song, Y., Liu, Y., Yang, Y., et al., ZnIn₂S₄-based photocatalysts for photocatalytic hydrogen evolution via water splitting, *Coord. Chem. Rev.*, 2023, vol. 475, art. ID 214898.
- 12. Zhang, X.-R., Ye, H., Liang, Y., Han, C., et al., Zinc indium sulfide-based photocatalysts for selective organic transformations, *Chem Cat Chem*, 2024, vol. 16, no. 13, art. ID e202301553.
- 13. Chen, Y.J., Hu, S.W., Liu, W.J., Chen, X.Y., et al., Controlled syntheses of cubic and hexagonal ZnIn₂S₄ nanostructures with different visible-light photocatalytic performance, *Dalton Trans.*, 2011, vol. 40, no. 11, p. 2607.
- 14. Peng, Sh., Zhu, P., Thavasi, V., Mhaisalkar, S.G., et al., Facile solution deposition of ZnIn₂S₄ nanosheet films on FTO substrates for photoelectric application, *Nanoscale*, 2011, vol. 3, no. 6, p. 2602.
- 15. Gou, X., Cheng, F., Shi, Yu., Zhang, I., et al., Shape-controlled synthesis of ternary chalcogenide ZnIn₂S₄ and CuIn(S,Se)₂ nano-/microstructures via facile solution route, *J. Amer. Chem. Soc.*, 2006, vol. 128, no. 22, p. 7222.
- 16. Kobzarenko, V.N., Donika, F.G. and Radautsan, S.I., Thin films of the one packet polytype of ZnIn₂S₄(I), *Phys. Stat. Sol.* (*a*), 1978, vol. 49, p. K5.
- 17. You, S.H., Hong, K.J., Jeong, T.S. and Youn, C.J., Structural, electric, and optical properties of MgGa₂Se₄ epilayers grown by hot wall epitaxy method, *J. Cryst. Growth.*, 2012, vol. 361, p. 142.
- 18. You, S.H., Hong, K.J., Jeong, T.S. and Youn, C.J., Growth and electrical/optical characteristics of unintentional *p*-type BaIn₂Se₄ epilayers grown using hot wall epitaxy method, *J. Cryst. Growth.*, 2013, vol. 383, p. 140.
- Tsurkan, A.E., Shemyakova, T.D. and Medvetskii, S.P., Influence of interface on the electrical behaviour of CdSe-CdTe photovoltaic cells, *Solar Energ. Mater.*, 1988, vol. 18, p. 61.
- 20. Иванов, А.П., Оптика рассеивающих сред. Минск: Наука и техника, 1969. 529 с.

- 21. Дамаскин, И.А., Пышкин, С.П., Кобзаренко, В.Н., Люминесценция тонких слоев тройных фаз системы ZnS − In₂S₃, ЖПС, 1981, vol. 34, № 5, с. 922.
- 22. Радауцан, С.И., Житарь, В.Ф., Райлян, В.Я., Оптическое поглощение монокристаллов $ZnIn_2S_4$, $\Phi T\Pi$, 1975, т. 9, № 12, с. 2278.

Summary

The technological regimes of preparation were determined, and $ZnIn_2S_4$ thin films were prepared on various orienting and nonorienting substrates – glass, fused silica, vitroceramics, glass covered with SnO_2 transparent

conductive layers, copper and steel plates, and mica – using the close-spaced vacuum sublimation method. The technological regimes of preparation of thin films of one- and three-packet polytype modifications of $ZnIn_2S_4$ (I, III) on glass substrates were found out. The films of the crystallite orientation with (0001) plane parallel to the substrate were obtained. The microstructure of the films was studied for various deposition regimes. The spectra of optical absorption and photoluminescence excitation were analyzed. It was shown that the parameters of the obtained thin films are close to those of $ZnIn_2S_4$ single crystals.

Keywords: ZnIn₂S₄, ternary semiconductors, thin films, close-spaced vacuum sublimation, absorption coefficient, photoluminescence